

異物分析、付着物分析に使用する装置と特徴一覧

分析装置	特徴
顕微赤外分光分析(FT-IR)	<ul style="list-style-type: none"> 主に有機物を定性分析 約20μmのものまで測定可能
元素分析(XMA)	<ul style="list-style-type: none"> 無機物、金属異物を定性分析 (1μm程度まで) 検出元素の概略定量分析、マッピング分析も可能
顕微ラマン分光分析(RAMAN)	<ul style="list-style-type: none"> 1μm程度の微小異物まで定性分析可能 カーボン、無機物などの同定も可能
光学顕微鏡(OM) (+偏光顕微鏡(POM))	<ul style="list-style-type: none"> 異物の形態を観察 製品中の発生位置(多層フィルム中の存在位置など)を観察
走査型電子顕微鏡(SEM)	<ul style="list-style-type: none"> 数nm～数百μmの観察が可能 異物や不具合部の表面(凹凸)形状・断面形態を観察

【異物分析 測定事例】

- 樹脂製品や食品、医薬品に混入した(練り込まれた)異物の定性
- 液中の異物分析(濾過、抽出等のサンプリングを行い、分析致します)
- フィルター捕集物の定性
- フィッシュアイの原因調査

【付着物分析 測定事例】

- 製造工程中に発生した付着物の分析
- 金属部品に付着したオイルの定性

【その他 測定事例】

- ゴム製品からブリードアウト(ブルーム)した成分の分析
- 印刷不具合箇所の原因調査
- 樹脂製品の変色原因、割れ原因の調査

上記以外でも、異物分析、付着物分析については多数実績が御座います。
分析手法の検討、ご提案もさせていただきます。